

XRR 解析レポート

プロジェクト

パス: 未保存  
DBでの共有レベル: 共有

解析条件

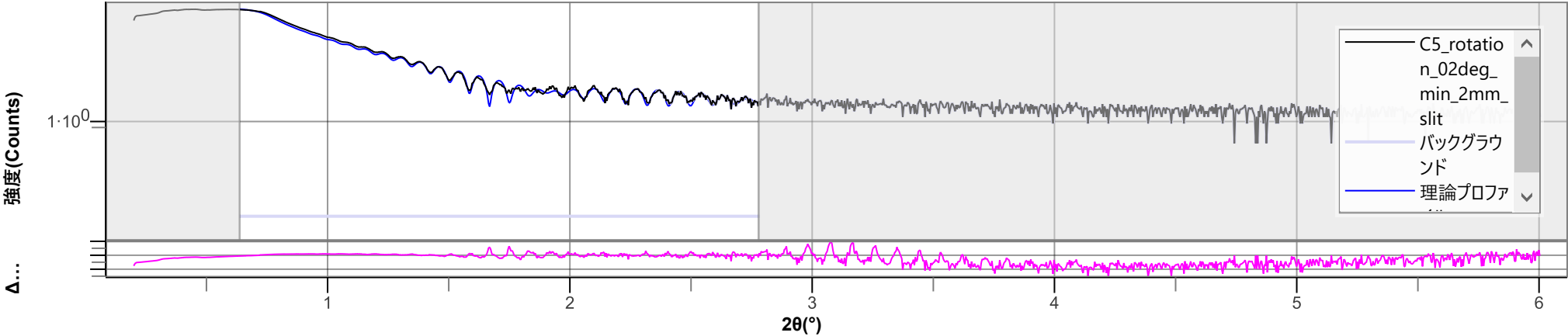
波長(nm): 0.15403  
点数: 1451  
2θ(°):開始 = 0.200, 終了 = 6.000  
ステップ = 0.004  
オフセット = 0.000e+000

フィッティング手法: 準ニュートン  
データ間隔:1点ごとにフィッティング  
残差タイプ: |Δ(LogI)|  
最大反復数: 500  
許容誤差: 1.00e-010

装置関数: 擬Voigt関数  
ローレンツ関数の比率: 0.00  
ローレンツ幅: 1.00e-002  
ガウス幅: 1.00e-002

結果

プロファイルプロット



	使用	層番号 ▼	材料	膜厚(nm)<th>	密度(g/cm³)<d>	粗さ(nm)<rg>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L4	Fe2O3	1.812 Const ±0.014 精密化	1.96777 Const ±0.013 精密化	0.100 Con... ±0.018 最小ー 精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L3	Fe2O3	2.055 Const ±1.1 精密化	4.95000 Const ±0.02 ー最大 精密化	0.000 Con... ±0.03 最小ー 精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L2	Fe	90.852 Const ±0.08 精密化	7.44743 Const ±0.02 精密化	0.487 Con... ±0.009 精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L1	Fe	1.986 Const ±0.06 精密化	7.87400 Const ±0.03 ー最大 精密化	0.000 Con... ±0.06 最小ー 精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	基板	Si	∞	2.32924 Const	0.500 Con...	